

Экранирование переменного магнитного поля пленками и монокристаллами высокотемпературных сверхпроводников

© Т.М. Бурбаев, Г.А. Калюжная, В.А. Курбатов, В.С. Ноздрин, Н.А. Пенин

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук,
117924 Москва, Россия

(Поступила в Редакцию 17 апреля 1996 г.
В окончательной редакции 6 августа 1996 г.)

Предложена методика измерения эффективности экранирования переменного магнитного поля сверхпроводящими пленками с применением полосковой линии в качестве источника переменного магнитного поля в широкой области частот. Исследована зависимость эффективности экранирования переменного магнитного поля пленками YBCO и монокристаллами BiSrCaCuO от температуры и частоты изменения магнитного поля, направленного перпендикулярно плоскости образца, в интервале частот от 10^4 до 10^9 Hz. Показано, что зависимость эффективности экранирования от температуры и частоты изменения магнитного поля существенно зависит от метода изготовления пленок.

Наряду с методом определения критической температуры высокотемпературных сверхпроводников по зависимости сопротивления от температуры на постоянном токе используются методы измерения T_c на переменном токе, например, по зависимости индуктивности соленоида с помещенным в него сверхпроводниковым образцом от температуры или по эффекту экранирования магнитного поля сверхпроводящей пленкой. Однако в случае тонких сверхпроводящих пленок (2D) или слоистых сверхпроводников критическая температура, определенная из измерений эффективности экранирования, зависит от частоты изменения магнитного поля [1,2], что было объяснено кинетикой образования и распада пар вихрей в тонких пленках [3]. Кроме того, зависимость глубины проникновения от частоты наблюдалась на толстых пленках YBCO в области частот от 1 kHz до 1 MHz [4]. Исследование влияния частоты изменения магнитного поля на эффективность экранирования сверхпроводящих образцов производилось либо в относительно узких интервалах частот, либо на сверхвысоких частотах. Цель настоящей работы состояла в исследовании влияния частоты изменения магнитного поля в широком интервале частот от 10^4 до 10^9 Hz на форму кривой перехода, полученной по зависимости эффективности экранирования переменного магнитного поля от температуры у сверхпроводящего монокристалла BiSrCaCuO и у пленок YBCO, изготовленных разными методами.

1. Экспериментальная техника и образцы

В качестве источника переменного магнитного поля использовалась симметричная полосковая линия, нагруженная на согласованное сопротивление и связанная с помощью петли с селективным вольтметром (рис. 1). При измерениях петля связи закрывалась

исследуемым образцом, размеры которого превышали размеры петли. Переменное магнитное поле было направлено перпендикулярно поверхности пленки. Наведенные в пленке вихревые токи вызывали изменение коэффициента связи $K = U_2/U_1$ и, следовательно, напряжения U_2 , создаваемого переменным магнитным полем в петле связи. Эффективность экранирования оценивалась по уменьшению коэффициента передачи K , возникающему при переходе образца в сверхпроводящее состояние.

Калибровка изменения коэффициента передачи в результате экранирования переменного магнитного поля производилась путем сравнения уменьшения коэффициента передачи при внесении в одном случае сверхпроводящего, а в другом — металлического экрана. В качестве металлического экрана использовалась медная фольга толщиной 0.05 mm. Такой экран при комнатной температуре обеспечивал полное экранирование переменного магнитного поля на частотах выше 1 MHz, в то время как экранирующие свойства сверхпроводящих образцов при $T < T_c$ оставались постоянными вплоть до минимальной использованной частоты 10^4 Hz. Максимальная величина изменения коэффициента передачи при внесении идеально экранирующего образца определялась конструктивными особенностями устройства и размерами исследуемых образцов и в лучшем случае достигала 12 dB.

Температурная зависимость напряжения на петле связи U_2 (при $U_1 = \text{const}$) измерялась на разных частотах в диапазоне от 10^4 до 10^9 Hz. Использованные величины тока в полосковой линии при измерениях не превышали 10^{-4} Å, что дает оценку максимальной величины магнитного поля, пронизывающего образец, меньше 10^{-8} T. При этих значениях поля полученные результаты не зависели от величины поля.

Нами исследовались пленки типа YBCO, изготовленные методом лазерного напыления на подложках

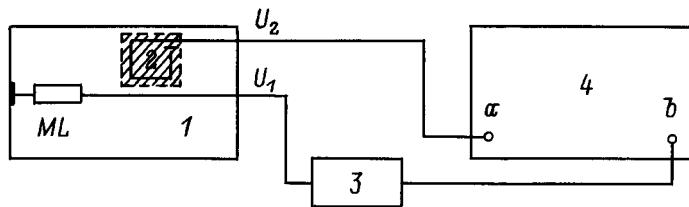


Рис. 1. Схема измерений эффективности экранирования переменного магнитного поля сверхпроводниковым образцом в широком диапазоне частот (10^4 – 10^9 Hz). 1 — полосковая линия с петлей связи, 2 — исследуемый образец, 3 — аттенюатор (TR1-50N-20), 4 — селективный вольтметр (SMV 11, SMV 8.5), a — вход приемника, b — выход калибровочного генератора.

из титаната стронция [5], толщиной 1500 Å, и изготовленные методом ионно-лучевого распыления [6] на подложке из ZrO_2 , стабилизированного иттрием; последние имели толщину 500 Å. Отметим, что в использованном диапазоне частот электрические свойства подложек (ϵ , $\operatorname{tg}\delta$) практически не влияли на результаты. При измерениях эффективности экранирования магнитного поля монокристаллами $BiSrCaCuO$ диаметр петли связи с линией составлял 0.5 mm, и изменение коэффициента передачи при сверхпроводящем переходе составляло величину 1 dB.

2. Результаты и обсуждение

На рис. 2 показаны температурные зависимости сигнала U_2 , измеренные на разных частотах изменения магнитного поля, и зависимость сопротивления пленки, измеренного на постоянном токе, для одной из пленок типа YBCO, изготовленных методом ла-

зерного напыления [5]. Как видно из этого рисунка, с увеличением частоты происходит рост температуры T_ω , при которой по мере уменьшения температуры пленки начинается уменьшение напряжения U_2 на петле связи, т. е. возникает эффект экранирования. Вместе с тем при постоянной температуре с увеличением частоты эффективность экранирования увеличивается (уменьшается напряжение U_2).

На рис. 3 приведены аналогичные зависимости сигнала U_2 для пленки типа YBCO, полученной методом ионно-лучевого напыления [6], не подвергнутой дополнительной тепловой обработке (кривые 1–7). Отметим, что полному экранированию в этом случае соответствует величина относительного сигнала $K = 0.45$.

Из приведенных данных следует, что зависимости сигнала U_2 от температуры на разных частотах у обеих разновидностей пленок имеют общий характер: крутизна изменения эффективности экранирования от температуры возрастает с уменьшением частоты. Однако этот эффект сильнее выражен у пленок, изготовленных методом лазерного напыления. При уменьшении частоты переменного магнитного поля зависимость U_2 от температуры приобретает пороговый характер: наиболее крутые части кривых зависимостей U_2 от температуры перестают зависеть от температуры по мере уменьшения частоты переменного магнитного поля.

Аналогичные измерения, выполненные на монокристаллических образцах типа $BiSrCaCuO$, толщина которых, как минимум, на два порядка превышала толщины исследованных пленок YBCO, показали, что зависимость сигнала U_2 для монокристалла имеет схожий характер с подобными зависимостями для пленок. Однако у монокристалла вид зависимости эффективности экранирования от температуры почти не зависит от частоты; кривые смещаются по температуре без существенного изменения формы (рис. 4).

На рис. 3 представлены также температурные зависимости сигнала U_2 , измеренные на различных частотах, для пленки YBCO, изготовленной методом ионно-лучевого напыления и подвергнутой отжигу в атмосфере кислорода при температуре 500 K (кри-

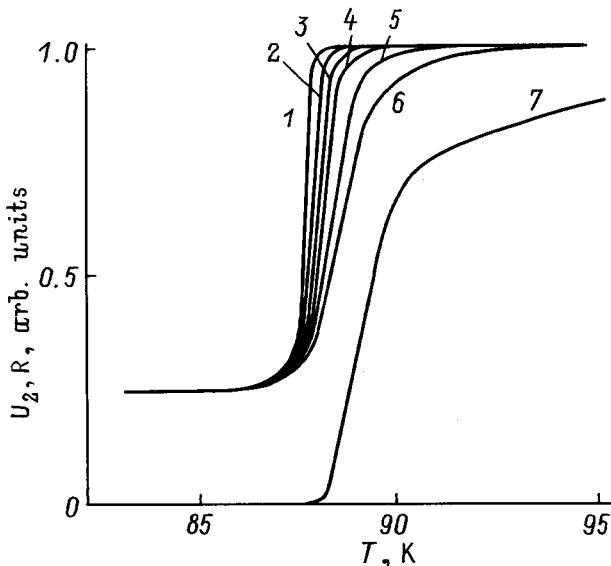


Рис. 2. Температурные зависимости U_2 (1–6) и сопротивления пленки на постоянном токе (7) для пленки YBCO, изготовленной лазерным напылением. Частоты изменения магнитного поля (MHz): 1 — 0.01, 2 — 1, 3 — 30, 4 — 100, 5 — 300, 6 — 10^3 .

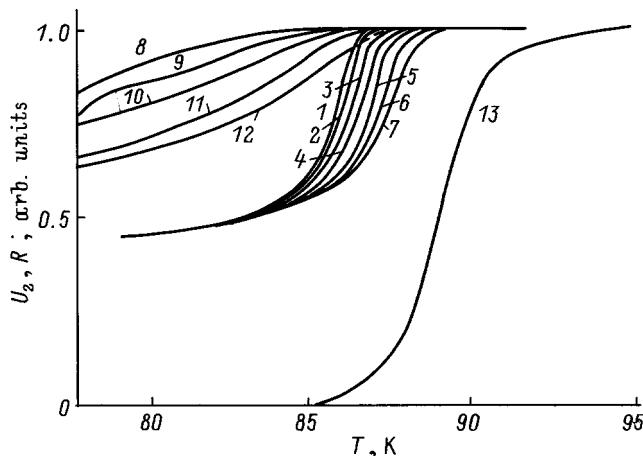


Рис. 3. Температурная зависимость U_2 (1–12) и сопротивления на постоянном токе (13) для пленки YBCO, изготовленной ионно-лучевым напылением. 1–7 — до отжига в диапазоне частот от 10 kHz (1) до 1 GHz (7); 8–12 — после отжига в диапазоне частот от 1 MHz (8) до 1 GHz (12).

вые 8–12). Там же приведена зависимость сопротивления отожженной пленки от температуры, измеренная на постоянном токе. Из этих данных следует, что в результате отжига пленки существенно ослабли температурные зависимости U_2 на всех использованных частотах и уменьшилась эффективность экранирования переменного магнитного поля.

Наблюдаемые изменения температурных зависимостей эффективности экранирования с изменением частоты переменного магнитного поля аналогичны изменениям эффективности экранирования, полученным одно- и двухкапушечным методами на аналогичных пленках типа YBCO [1,2]. В этих работах результаты исследований были объяснены на осно-

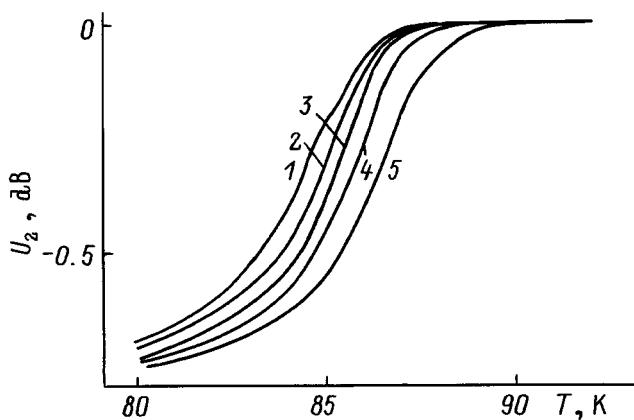


Рис. 4. Зависимость U_2 от температуры для монокристалла BiSrCaCuO. Частоты изменения магнитного поля (MHz): 1 — 1, 2 — 30, 3 — 100, 4 — 300, 5 — 10^3 .

ве эффекта образования вихрей в тонких пленках. Согласно [3], в тонких двумерных сверхпроводящих пленках возникают термически возбужденные вихри, которые связываются в пары с противоположными направлениями вращения (тока) при $T < T_v$ и диссоциируют на свободные вихри при $T > T_v$, где T_v — температура, характеризующая энергию связи вихрей; при этом $T_v < T_c$. Под действием переменного магнитного поля происходит переориентация (поляризация) взаимодействующих вихрей. Как следствие при заданной температуре импеданс сверхпроводящей пленки и, следовательно, эффективность экранирования магнитного поля пленкой зависят от концентрации связанных в пары и свободных вихрей и от частоты изменения магнитного поля.

Очевидно, что усиление экранирования с увеличением частоты изменения магнитного поля при постоянной температуре и соответствующее увеличение T_ω , наблюдаемое у исследованных нами сверхпроводящих образцов, также можно приписать влиянию кинетики возникновения и распада вихрей. Эффект увеличения максимальной крутизны зависимости эффективности экранирования с уменьшением температуры и частоты переменного магнитного поля требует более детальных дальнейших исследований.

В заключение отметим, что эффективность экранирования переменного магнитного поля высокотемпературными сверхпроводящими пленками зависит от метода изготовления пленок.

Измерение температурно-частотных зависимостей эффективности экранирования в широкой области частот с использованием полосковой линии в качестве источника переменного магнитного поля может быть одним из методов контроля и исследования свойств сверхпроводящих пленок, не требующим создания контактов на исследуемых образцах.

Работа поддержана Российской научно-технической программой "Высокотемпературная сверхпроводимость" (проект № 930016).

Список литературы

- [1] A.T. Fiory, A. Hebard, P.M. Mankiewich, R.E. Howard. Phys. Rev. Lett. **61**, 1419 (1988).
- [2] V.A. Gasparov. Physica **C178**, 449 (1991).
- [3] V. Ambegaokar, B.I. Halperin, D.R. Nelson, E.D. Siggia. Phys. Rev. Lett. **40**, 783 (1978).
- [4] A.C. Bodi, T. Kokkomki, S. Leppavuori, J. Vayrynen. Physica **C253**, 115 (1995).
- [5] A.I. Golovashkin, E.V. Ekimov, S.I. Krasnosvobodtsev et al. Physica **C162–164**, 715 (1989).
- [6] A.V. Bagulya, I.P. Kazakov, M.A. Negodaev, V.L. Tsekhsosh, V.V. Voronov. Mater. Sci. Eng. **21**, 5 (1993).